### 04

# Влияние температуры спекания на микроструктуру и диэлектрические свойства Bi<sub>4</sub>Ti<sub>3</sub>O<sub>12</sub>, легированного неодимом

© С.В. Зубков<sup>1</sup>, И.А. Паринов<sup>2</sup>, А.В. Назаренко<sup>3</sup>, А.В. Павленко<sup>1,3</sup>

<sup>1</sup> Научно-исследовательский институт физики Южного федерального университета,

Ростов-на-Дону, Россия <sup>2</sup> Институт математики, механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича Южного федерального университета, Ростов-на-Дону, Россия, <sup>3</sup> Федеральный исследовательский центр Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону, Россия, E-mail: svzubkov61@mail.ru

Поступила в Редакцию 23 мая 2023 г. В окончательной редакции 25 мая 2023 г. Принята к публикации 14 июня 2023 г.

Методом высокотемпературной твердофазной реакции при температурах 1000 и 1050°С синтезирован новый набор перовскитоподобных оксидов  $Bi_{4-x}Nd_xTi_3O_{12}$  (x = 0.1, 0.3, 0.5, 0.7). Рентгеноструктурное исследование показало, что эти соединения являются однофазными и имеют структуру семейства фаз Ауривиллиуса ( $\Phi$ A) с параметрами, близкими к орторомбической элементарной ячейке, соответствующей пространственной группе B2cb (41). Для всех полученных составов  $Bi_{4-x}Nd_xTi_3O_{12}$  (x = 0.1, 0.3, 0.5, 0.7) при температурах спекания 1000°С и 1050°С исследована микроструктура. Ее анализ также показал, что кристаллиты имеют пластинчатую форму, характерную для  $\Phi$ А. Относительная диэлектрическая проницаемость  $\varepsilon/\varepsilon_0$  и тангенс угла диэлектрических потерь tg  $\delta$  измерялись в зависимости от температуры на частотах 100 kHz до 1 MHz.

Ключевые слова: фазы Ауривиллиуса,  $Bi_{4-x}Nd_xTi_3O_{12}$ , температура Кюри  $T_C$ , микроструктура, диэлектрическая проницаемость.

DOI: 10.21883/FTT.2023.08.56146.88

## 1. Введение

В 1949 г. при исследовании системы  $Bi_2O_3$ -TiO<sub>2</sub> В. Ауривиллиус синтезировал оксид Bi<sub>4</sub>Ti<sub>3</sub>O<sub>12</sub> со структурой типа перовскита [1,2]. Однако сначала В. Ауривиллиус ограничился изучением строения полученного соединения. В 1950 г. Смоленский и др. [3] предположили возникновение спонтанной поляризации в перовскитоподобном слое, состоящем из октаэдров. Лишь спустя почти десять лет Смоленский и др. [4] открыли сегнетоэлектрические свойства Bi<sub>2</sub>PbNbO<sub>9</sub>, относящегося к этому классу соединений. В течение нескольких лет было синтезировано несколько десятков ФА и почти все они были сегнетоэлектриками [5,6]. Общая формула  $A_{m-1}Bi_2B_mO_{3m+3}$ . Кристаллическая структура ФА включает чередующиеся слои  $[Bi_2O_2]^{2+}$ , разделенные *m* перовскито подобными слоями  $[A_{m-1}B_mO_{3m+1}]^{2-}$ , где ионы A имеют большие радиусы (Bi<sup>3+</sup> [7], Ca<sup>2+</sup>,  $Gd^{3+}$  [8],  $Sr^{2+}$ ,  $Ba^{2+}$ ,  $Pb^{2+}$ ,  $Na^+$ ,  $K^+$ ,  $Y^{3+}$  [9],  $Ln^{3+}$ , Nd<sup>3+</sup> [10], Lu<sup>3+</sup> [11] (лантаниды)) и демонстрируют додекаэдрическую координацию. Позиции В в кислородных октаэдрах заняты высокозарядными (> 3+) катионами малого радиуса (Ti<sup>4+</sup>, V, Nb<sup>5+</sup>, Ta<sup>5+</sup> [12], W<sup>6+</sup> [13], Mo<sup>6+</sup>, Fe<sup>3+</sup>, Mn<sup>4+</sup>, Cr<sup>3+</sup>, Ga<sup>3</sup>, др.).

Величина *m* определяется количеством перовскитовых слоев  $[A_{m-1}B_mO_{3m+1}]^{2-}$ , расположенных между флюо-

ритоподобными слоями  $[Bi_2O_2]^{2+}$  вдоль псевдотетрагональной *с*-оси [14], и может быть целым или полуцелым числом в диапазоне m = 1-5 (см. рис. 1). Замещения атомов в положениях A и B существенно влияют на электрофизические свойства ФА. В частности, имеют место большие изменения величин диэлектрической проницаемости, электропроводности, кроме того, температура Кюри  $T_C$  также может изменяться в широких пределах. Таким образом, исследование катионзамещенных соединений ФА имеет большое значение при разработке материалов различного технического назначения.

Структура ФА соединений  $Bi_2A_{m-1}B_mO_{3m+3}$  выше точки Кюри  $T_C$  является тетрагональной и относится к пространственной группе I4/mmm. Тип пространственной группы ниже точки Кюри  $T_C$  определяется величиной *m*. Пространственная группа сегнетоэлектрической фазы: B2cb или Pca2<sub>1</sub> для нечетных *m*, A2<sub>1</sub>am для четных *m* и Cmm2 или I2cm для полуцелых *m*.

Многие исследования были сосредоточены на использовании  $\Phi A$  в энергонезависимой ферроэлектрической системе памяти FeRAM с произвольным доступом [15] с потенциальной возможностью широкого применения в электронной промышленности, как например: конденсаторы и датчики [16]. Ві<sub>4</sub>Ті<sub>3</sub>O<sub>12</sub> (ВіТ) является одним из наиболее изученных соединений семейства  $\Phi A$  [17]. Спонтанная поляризация *Ps* соединений с

четным числом слоев происходит только вдоль оси а. Сильная спонтанная поляризация BiT в *аb*-плоскости возникает из-за смещения атомов Ві в А-положении относительно октаэдра [TiO<sub>6</sub>] вдоль оси a, в то время как нецентральные смещения Ті в октаэдре для Ps играют незначительную роль, в дополнение к большой поляризации вдоль оси а. В последнее время сегнетоэлектрики со слоистой структурой висмута (BLSF) привлекли большое внимание из-за их превосходных сегнетоэлектрических свойств и работы без усталости. Кроме того, семейство сегнетоэлектриков со слоистой структурой висмута является одним из перспективных бессвинцовых материалов с точки зрения их применения в функциональных устройствах электроники, таких как резонаторы и высокотемпературные датчики. Это связано с тем, что ВіТ имеет высокую температуру Кюри  $T_{\rm C} = 675^{\circ}{\rm C}$  и высокую остаточную поляризацию (Pr)  $50 \,\mu\,\text{C/cm}^2$  [18].

Однако основной проблемой при исследовании ВіТ [19-28] было названо наличие кислородных вакансий. Дефицит кислорода вызывает высокие токи утечки и значения электропроводности, что может мешать процессу поляризации материалов BiT [29-33]. Для улучшения свойств BLSF как в тонкопленочной, так и в керамической форме использовались различные методы синтеза [34-38]. Для тонких пленок ряд исследований показал, что морфологию зерен с высокой ориентацией вдоль оси с можно получить с помощью нескольких методов обработки, в частности, методом выращивания зерен по шаблону, что позволило измерить анизотропные свойства этих пленок [39-42]. В керамике хорошо известно, что как "чистые", так и легированные BLSF имеют и свойства, которые также зависят от ориентации пластинчатых зерен. Например, диэлектрические свойства вдоль направлений, перпендикулярных и параллельных оси с, оказались совершенно разными [43]. Поэтому, из-за анизотропного поведения этого материала, керамика BLSF была синтезирована с зернами, ориентированными в определенном направлении, с использованием различных методов, таких как рост зерна по образцу и литье ленты [44]. Более того, используя внешние параметры, такие как магнитное поле или давление, можно было изготовить и керамику с ориентированными зернами [44]. ВіТ-керамика с высоко ориентированными зернами может быть изготовлена из прессованных пластинчатых порошков, изготовленных из растворов солей. Однако полученная керамика имеет большие поры между хорошо спеченными пластинчатыми колониями зерен. В этой статье мы использовали путь твердофазной реакции для синтеза керамики. В раннем исследовании мы обнаружили, что при спекании при различных температурах происходят значительные изменения кристаллической структуры и значения диэлектрической проницаемости [45]. Целью настоящей работы было исследование изменений микроструктуры и относительной диэлектрической проницаемости при увеличении температуры спекания  $Bi_{4-x}Nd_xTi_3O_{12}$ (x = 0.1, 0.3, 0.5, 0.7).

# 2. Эксперимент

Поликристаллические образцы ФА Ві<sub>4-х</sub>Nd<sub>x</sub>Ti<sub>3</sub>O<sub>12</sub> (x = 0.1, 0.3, 0.5, 0.7) были синтезированы твердофазной реакцией оксидов Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, TiO<sub>2</sub>. Все исходные соединения имели квалификацию ч.д.а. После взвешивания по стехиометрическому составу и измельчения исходных оксидов с добавлением этилового спирта прессованные образцы прокаливали при температуре 780°С в течение 4h с промежуточным дроблением и измельчением. Образцы обжигали в лабораторной муфельной печи на воздухе. Затем образцы измельчали, повторно дробили и прессовали в таблетки диаметром 10 mm и толщиной 1.0-1.5 mm при 1000°С (в течение 2 h) или 1050°С (в течение 2 h). Рентгенограммы были получены с помощью медной рентгеновской трубки. Излучение Си Ка1, а2 отделялось от всего спектра с помощью Ni-фильтра. Рентгенограмма измерялась в диапазоне углов  $2\theta$  от  $10^{\circ}$  до  $60^{\circ}$  с шагом сканирования  $0.02^{\circ}$  и временем регистрации интенсивности (экспозиции) 12 s на точку. Изучение профиля дифрактограммы, определение положения линий, их индексацию (hkl) и уточнение параметров элементарной ячейки проводили с помощью программы PCW2.4 [46]. Для измерения диэлектрической проницаемости и электропроводности электроды размещали на плоские поверхности образцов в виде дисков диаметром 10 mm и толщиной около 1.5 mm с помощью Ад-пасты, которые обжигали при температуре 700°С в течение 30 min. Зависимости диэлектрических характеристик от температуры и частоты определяли с помощью измерителя иммитанса Е7-20 в диапазоне частот от 100 kHz до 1 MHz и в диапазоне температур от комнатной до 900°С. Образцы поляризовали на масляной бане при 125°C при напряжении 35 kV/cm в течение 30 min.

Фотографии микроструктуры ряда синтезированной перовскитоподобной керамии  $Bi_{4-x}Nd_xTi_3O_{12}$  (x = 0.1, 0.3, 0.5, 0.7) получены на сканирующем электронном микроскопе Carl Zeiss EVO 40 (Германия) в Центре коллективного пользования ЮНЦ РАН. Исследования проводились на поперечных сколах. В отсутствие дополнительного проводящего слоя наблюдалось размытие изображения зерен и различные эффекты накопления заряда, особенно по границам зерен. Поэтому для исследования поверхности скола был нанесен проводящий слой с помощью установки магнетронного напыления SC7620 MiniSputterCoater. Перед напылением образцы не подвергались механической обработке. Исследования проводились в режиме высокого ускоряющего напряжения (EHT =  $20 \,\text{kV}$ ). Для увеличения разрешения использовался ток зонда  $I_{\text{probe}} = 20 \text{ pA}$  и рабочее расстояние WD = 6 - 8 mm.



**Рис. 1.** Структуры фаз Ауривиллиуса: *m* = 2, 3, 4.

# 3. Результаты и их обсуждение

Порошковые рентгенограммы керамик, спеченных при 1000°С и 1050°С, в интервале углов  $2\theta$  10–60°, представлены на рис. 2, 3 соответственно. Все синтезированные твердые растворы  $\text{Bi}_{4-x}\text{Nd}_x\text{Ti}_3\text{O}_{12}$  (x = 0.1, 0.3, 0.5, 0.7) соответствуют однофазным ФА с m = 3и не содержат дополнительных рефлексов, что свидетельствует о вхождении ионов  $\text{Nd}^{3+}$  в решетку и образовании твердых растворов.

Все исследованные твердые растворы  $\text{Вi}_{4-x}\text{Nd}_x\text{Ti}_3\text{O}_{12}$ (x = 0.1, 0.3, 0.5, 0.7) изоструктурны известному перовскитоподобному соединению  $\text{Bi}_4\text{Ti}_3\text{O}_{12}$ . Пик (117) на рентгенограмме рис. 1, 2 показывает самую высокую интенсивность в плоскости (11(2m + 1)). Этот типичный дифракционный пик соответствует слоистой структуре ВіТ. Видно, что степень ориентации 00l керамики остается постоянной и не зависит от концентрации  $\text{Nd}^{3+}$ , что характерно при спекании в течение короткого (t < 25 h) времени. На рис. 2 можно видеть, что пик (117) смещается в сторону большего угла при увеличении x от 0.1 до 0.7.

С другой стороны, орторомбическая структура ВіТ обычно приводит к расщеплению пиков (hkl)/(khl)  $(h \neq k)$  из-за малой разницы в постоянных решетки *а* и *b*. На рис. 2, *b* угол дифракции пика (020) соответствует той же тенденции, что и пик (117), в то время

как угол дифракции пика (200) в основном остается неизменным. Эти два пика могут быть связаны с изменением размеров осей a и b соответственно. Кроме того, за изменение углов пиков (220) и (115) могут быть ответственны искажение решетки и изменение объема объединенной ячейки, как показано на рис. 2, c. Расщепление пика (220) типично для орторомбической симметрии [47–48]. Однако, как и в классических случаях для порошковых образцов, когда кристалличность недостаточно высока и моноклинное искажение не наблюдается, фазы индексируются как орторомбические B2cb [49].

#### 3.1. Микроструктура

Анализ изображений показал, что термодинамическая предыстория изготовления материалов достаточно сильно влияет на морфологию микроструктуры. Образцы, синтезированные при температуре 1000°С, характеризуются достаточно мелкими размерами кристаллитов (рис. 4, 5). Можно отметить, что прочность связи зерен по границам ниже, прочности самого зерна, поэтому скол происходил в основном по границам. С увеличением количества неодима зерна приобретают более плоскую форму, при этом упаковываясь в более плотную структуру. При x = 0.1 и 0.3 средний размер кристаллитов составляет около 0.95–1.2 $\mu$ m, а при x = 0.5 — около 0.7 $\mu$ m. Распределение по размерам во всех случаях является логнормальным.

При повышении температуры спекания всего на 50°C (с 1000°C до 1050°C) ситуация существенно меняется (см. рис. 4, 5, *b*). Во-первых, зерна становятся заметно крупнее. При концентрациях x = 0.1, 0.3 рост составил приблизительно 1.5–2 раза, а при концентрациях



**Рис. 2.** Дифрактограммы керамик  $Bi_{4-x}Nd_xTi_3O_{12}$  (x = 0.1, 0.3, 0.5, 0.7), спеченных при 1000°С, в диапазоне углов  $2\theta$  10°-60°: a — общая картина, b, c — детальное изображение наиболее характерных пиков.



Рис. 3. Рентгенограммы керамик  $Bi_{4-x}Nd_xTi_3O_{12}$  (x = 0.1, 0.3, 0.5, 0.7), спеченных при 1050°С, в диапазоне углов  $2\theta$  10°-60°.

x = 0.5, 0.7 рост более существенен — 2.5–3 раза. Вовторых, в отличие от керамик, спеченных при 1000°С, после температуры 1050°С поперечный скол происходил преимущественно по зернам (т.е. скалывались сами зерна), что свидетельствует об усилении прочности межзеренных границ. Это подтверждает предположение о том, что синтез протекает с участием жидкой фазы. Местами можно наблюдать их неоднородную (слоистую) структуру (рис. 4, *b*, *d*, *f* стрелки). Это указывает на рост зерен вдоль плоскости a-b, перпендикулярной кристаллографической оси *c*, что полностью соответствует структуре типа ФА.

Анализ общих статистических данных по диапазону размеров кристаллитов керамик  $Bi_{3.3}Nd_{0.7}Ti_3O_{12}$  (см. рис. 5, *b*) позволяет сделать вывод, что их разброс в обоих случаях также подчиняется стандартному логарифмически нормальному распределению со средним размером ~ 1.1  $\mu$ m (для  $T = 1000^{\circ}$ C) и ~ 2.5  $\mu$ m ( $T = 1050^{\circ}$ C). В то же время в подтверждение роста среднего размера зерен при повышении температуры спекания видно, что 93% размеров всех зерен керамики, изготовленной при  $T = 1050^{\circ}$ C, находятся в пределах 1.5–4 $\mu$ m, в то время как для керамики, изготовленной при  $T = 1000^{\circ}$ C, этот диапазон составляет всего  $1-2\mu$ m.

#### 3.2. Диэлектрические свойства

На рис. 6 представлены зависимости относительной диэлектрической проницаемости  $\varepsilon/\varepsilon_0$  и тангенса угла диэлектрических потерь tg  $\delta$  от температуры для  $\Phi A$  Bi<sub>4-x</sub>Nd<sub>x</sub>Ti<sub>3</sub>O<sub>12</sub> (x = 0.1, 0.3, 0.5, 0.7) при значениях частоты от 100 kHz до 1 MHz для керамик, спеченных



**Рис. 4.** Микроструктура поверхностей сколов керамик Bi<sub>4-x</sub>Nd<sub>x</sub>Ti<sub>3</sub>O<sub>12</sub> послесинтеза при 1000°C (*a*, *c*, *e*) и при 1050°C (*b*, *d*, *f*). На вставках приведены гистограммы соответствующих распределений зерен по размерам.

при температурах 1000°С и 1050°С. Как видно из рис. 6, значительное снижение температуры Кюри  $T_{\rm C}$  (от 695°С до 580°С) связано с легированием Nd<sup>3+</sup>.

На рис. 6 видно, что с увеличением нагрева образцов от  $1000^\circ\mathrm{C}$  до  $1050^\circ\mathrm{C}$  тангенс угла диэлектрических по-

терь для состава  ${\rm Bi}_{4-x}{\rm Nd}_x{\rm Ti}_3{\rm O}_{12}$  (x=0.1) увеличивается в 1.5 раза. Как известно, при температуре  $T>1000^{\circ}{\rm C}$   ${\rm Bi}^{3+}$  "вылетает" и образуются кислородные вакансии. Образование вакансий  ${\rm Bi}^{3+}$  происходит преимущественно в А-позициях перовскитоподобного слоя, а не в



**Рис. 5.** Микроструктура поверхностей сколов керамики  $Bi_{3.3}Nd_{0.7}Ti_3O_{12}$  после синтеза при 1000°C (*a*) и 1050°C (*b*) и сравнительная гистограмма температурной эволюции распределений их зерен по размерам (*c*).



**Puc. 6.** Температурно-частотные зависимости относительной диэлектрической проницаемости  $\varepsilon/\varepsilon_0$  и тангенса угла диэлектрических потерь tg δ (вставки) для ΦA Bi<sub>4-x</sub>Nd<sub>x</sub>Ti<sub>3</sub>O<sub>12</sub> (x = 0.1 (a, b), 0.3 (c, d), 0.5 (e, f), 0.7 (g, h)) после синтеза при 1000°C (a, c, e, g) и 1050°C (b, d, f, h) в диапазоне частот от 100 kHz до 1 MHz и температур 25–750°C.

слоях  $Bi_2O_2^{2+}$ , что приводит к образованию кислородных вакансий в перовскитоподобном слое.

Увеличение значения тангенса угла диэлектрических потерь tg  $\delta$  объясняется тем, что электропроводность по оси *a* на несколько порядков больше, чем по оси *c*. Оксидно-ионная проводимость, обусловленная большим

количеством кислородных вакансий в перовскитоподобных слоях, что приводит к большой проводимости вдоль оси а при 700°С, при измерении относительной диэлектрической проницаемости  $\varepsilon/\varepsilon_0(T)$  с изменением температуры. Как было показано на рис. 4, *a*, *b*, при повышении температуры спекания размеры зерен в *ab*-плоскости



Рис. 6 (продолжение).

увеличиваются, что приводит к увеличению проводимости и росту тангенса угла диэлектрических потерь для  $Bi_{4-x}Nd_xTi_3O_{12}$  (x = 0.1) (рис. 6, *a*, *b*).

Дальнейшее легирование состава Bi<sub>4-x</sub>Nd<sub>x</sub>Ti<sub>3</sub>O<sub>12</sub> ионами Nd<sup>3+</sup> приводит к уменьшению тангенса угла диэлектрических потерь в 2 раза, что свидетельствует об уменьшении концентрации кислородных вакансий. Отчетливо наблюдается для всего ряда синтезированных соединений  $Bi_{4-x}Nd_xTi_3O_{12}$  (x = 0.1, 0.3, 0.5, 0.7) высокотемпературная аномалия относительной диэлектрической проницаемости  $\varepsilon/\varepsilon_0$ , которая соответствует переходу из тетрагонального в орторомбическое состояние. Также наблюдается низкотемпературная аномалия относительной диэлектрической проницаемости  $\varepsilon/\varepsilon_0$ , измеренной в диапазоне температур 200-600°С. Низкотемпературная диэлектрическая аномалия для  $Bi_{4-x}Nd_xTi_3O_{12}$  (x = 0.1, 0.3, 0.5, 0.7) представляет собой комбинацию релаксационных пиков, зависящих от частоты, что согласуется с результатами H.S. Shulman et al. [22].

Как видно из рис. 6, c, d с увеличением концентрации ионов Nd<sup>3+</sup> x > 0.3 наблюдается сдвиг максимумов относительной диэлектрической проницаемости с частотой, что соответствует появлению релаксорных состояний. Также наблюдается размытие максимумов относительной диэлектрической проницаемости по температуре. Релаксация в интервале температур от 200°С



**Рис. 7.** Зависимость  $\ln \sigma$  от 10000/T для образца  $\text{Bi}_{4-x}\text{Nd}x\text{Ti}_3\text{O}_{12}$  с x = 0.1 на частоте 100 kHz.

-	Compound	$a_0, \mathrm{\AA}$	$b_0, { m \AA}$	$c_0, \mathrm{\AA}$	$V_{1000}, {\rm \AA}^3$	$\delta b_0$	<i>c′</i>	$a_t$	$\Delta c'$
_	Bi <sub>3.9</sub> Nd <sub>0.1</sub> Ti <sub>3</sub> O <sub>12</sub>	5.405	5.436	32.824	964.242	0.061	4.103	3.830	0.070
	${\rm Bi}_{3.7}{\rm Nd}_{0.3}{\rm Ti}_{3}{\rm O}_{12}$	5.403	5.439	32.805	963.246	0.066	4.100	3.830	0.070
	$Bi_{3.5}Nd_{0.5}Ti_{3}O_{12}$	5.405	5.419	32.815	961.141	0.026	4.101	3.826	0.070
	Bi <sub>3.3</sub> Nd <sub>0.7</sub> Ti <sub>3</sub> O <sub>12</sub>	5.399	5.419	32.817	960.133	0.037	4.102	3.826	0.070

**Таблица 1.** Параметры элементарной ячейки  $a_0$ ,  $b_0$ ,  $c_0$ , V;  $a_t$  — средний тетрагональный период, c' — высота октаэдра вдоль оси c,  $\delta c'$  — отклонение от кубической формы,  $\delta b_0$  — ромбическая дисторсия для керамики, спеченной при температуре 1000°С

**Таблица 2.** Параметры элементарной ячейки  $a_0$ ,  $b_0$ ,  $c_0$ , V;  $a_t$  — средний тетрагональный период, c' — высота октаэдра вдоль оси c,  $\delta c'$  — отклонение от кубической формы,  $\delta b_0$  — орторомбическое искажение для керамики, спеченной при температуре 1050°C

Compound	<i>a</i> <sub>0</sub> , Å	$b_0, \mathrm{\AA}$	<i>c</i> <sub>0</sub> , Å	$V_{1050}, \mathrm{\AA}^3$	t	$\delta b_0$	<i>c′</i>	$a_t$	$\Delta c'$
Bi <sub>3.9</sub> Nd <sub>0.1</sub> Ti <sub>3</sub> O <sub>12</sub>	5.409	5.430	32.821	963.746	0.979	0.388	4.103	3.830	0.070
Bi <sub>3.7</sub> Nd <sub>0.3</sub> Ti <sub>3</sub> O <sub>12</sub>	5.405	5.430	32.813	963.033	0.976	0.462	4.101	3.830	0.070
Bi <sub>3.5</sub> Nd <sub>0.5</sub> Ti <sub>3</sub> O <sub>12</sub>	5.404	5.410	32.798	958.160	0.974	0.110	4.099	3.823	0.070
Bi <sub>3.3</sub> Nd <sub>0.7</sub> Ti <sub>3</sub> O <sub>12</sub>	5.400	5.412	32.790	958.120	0.971	0.220	4.098	3.822	0.070

**Таблица 3.** Значения толеранс фактора t, температуры Кюри  $T_{\rm C}$ , относительной диэлектрической проницаемости и энергии активации  $E_{1,2}$  для керамики  ${\rm Bi}_{4-x}{\rm Nd}_x{\rm Ti}_3{\rm O}_{12}$  (x = 0.1, 0.3, 0.5, 0.7), спеченной при 1000°C и 1050°C

	Compound	<i>t</i> -factor	$T_{\rm C1000}/T_{\rm C1050}$	$arepsilon_{1000}^\prime/arepsilon_{1050}^\prime$	$E_1/E_2$ , eV at 1000°C	$E_1/E_2$ , eV at 1050°C
1	Bi <sub>3.9</sub> Nd <sub>0.1</sub> Ti <sub>3</sub> O <sub>12</sub>	0.978	695/680	1250/5000	0.56/0.04	0.50/0.03
2	$Bi_{3.7}Nd_{0.3}Ti_{3}O_{12}$	0.976	655/650	2805/3619	0.55/0.05	0.56/0.02
3	${\rm Bi}_{3.5}{\rm Nd}_{0.5}{\rm Ti}_{3}{\rm O}_{12}$	0.974	610/645	2300/4800	0.54/0.03	0.59/0.05
4	$Bi_{3.3}Nd_{0.7}Ti_{3}O_{12}$	0.971	580/600	1600/3000	0.56/0.02	0.58/0.06

до 500°С, вероятно, связана со смещением анионов кислорода на короткие расстояния в кристалле или с образованием барьеров Шоттки между "керамическим" и металлическим электродами из-за разницы уровней Ферми между ними [50]. Керамика ВіТ обладала низкой пьезоактивностью ( $d_{33} \le 8 \text{ pC/N}$ ), легирование Nd<sup>3+</sup> не привело к изменению пьезоактивности. После поляризации образцов Bi<sub>4-x</sub>Nd<sub>x</sub>Ti<sub>3</sub>O<sub>12</sub> (x = 0.1, 0.3, 0.5, 0.7) вновь измерялась зависимость диэлектрической проницаемости от температуры. Установлено, что температура Кюри  $T_{\rm C}$  при этом уменьшилась на 10°С.

Параметры и объем элементарной ячейки определялись на основе данных рентгеноструктурного анализа; они приведены в табл. 1 (для температуры 1000°С) и табл. 2 (для температуры 1050°С).

Полученные параметры элементарной ячейки для образцов  $\text{Bi}_{4-x}\text{Nd}_x\text{Ti}_3\text{O}_{12}~(x=0.1,~0.3,~0.5,~0.7)$  близки к определенным ранее для ФА  $\text{Bi}_4\text{Ti}_3\text{O}_{12}~[38]$ : a = 5.411 Å, b = 5.448 Å, c = 32.81 АА. Для того чтобы получить

степень искажения идеальной структуры перовскита, мы определили толеранс фактор *t*, представленный в табл. 3. Толеранс фактора *t* был введен В.М. Гольдшмидтом [51], как геометрический критерий, определяющий степень устойчивости и искажения кристаллической структуры

$$t = (R_{\rm A} + R_{\rm O}) / \left[ \sqrt{2} (R_{\rm B} + R_{\rm O}) \right],$$
 (1)

где  $R_{\rm A}$  и  $R_{\rm B}$  — радиусы катионов в А- и В-положениях соответственно;  $R_{\rm O}$  — ионный радиус кислорода. Здесь мы рассчитали коэффициент толерантности, используя ионные радиусы Шеннона [52], для соответствующих координационных чисел (КЧ) (КЧ = 6 для  $O_2$ ,  $R_{\rm O} = 1.40$  Å; КЧ = 12 для Nd<sup>3+</sup>,  $R_{\rm Nd}^{3+} = 1.27$  Å; КЧ = 6 для Ti<sup>4+</sup>,  $R_{\rm Ti}^{4+} = 0.605$  Å).

Р.Д. Шеннон не привел ионный радиус  ${\rm Bi}^{3+}$  для координации с KЧ = 12. Поэтому его величина определялась из ионного радиуса с KЧ = 8 ( $R_{{\rm Bi}3+}$  = 1.17 Å), умноженного на коэффициент аппроксимации 1.179; то для  ${\rm Bi}^{3+}$  (KЧ = 12) мы получили  $R_{{\rm Bi}3+}$  = 1.3 Å.

В табл. 1,2 приведены параметры ромбической  $\delta b_0$  и тетрагональной  $\delta c'$  деформации; средний тетрагональный период при средней мощности одного перовскитового слоя c'; c' = 3c/(8 + 6m) — высота одиночного перовскитоподобного слоя,  $a_t = (a_0 + b_0)/2$  — среднее значение тетрагонального периода;  $a_0$ ,  $b_0$ ,  $c_0$  — параметры решетки;  $\delta c' = (c' - a_t)/a_t$  — отклонение формы элементарной ячейки от кубической, то есть удлинение или сжатие;  $\delta b_0 = (b_0 - a_0)/a_0$  — орторомбическая деформация,  $c_0 = c/(2 + 1.5m)$  — толщина слоя кислоро-

$$\sigma = (A/T) \exp[-E_a/(kT)], \qquad (2)$$

где  $\sigma$  — электропроводность, k — постоянная Больцмана, А — константа, Е<sub>а</sub> — энергия активации. Зависимость  $\ln \sigma$  ( $\sigma$ -проводимости) от 1/T (на частоте 100 kHz), используемая для определения энергии активации  $E_a$ , представлена на рис. 7 для  $\Phi A Bi_{4-x} Nd_x Ti_3 O_{12}$ (x = 0.1, 0.3, 0.5, 0.7). Соединения  $Bi_{4-x}Nd_xTi_3O_{12}$ (x = 0.1, 0.3, 0.5, 0.7) демонстрируют два температурных интервала, где энергия активации проводимости Е<sub>а</sub> существенно различается по величине. В области низких температур электропроводность определяется в основном примесными дефектами с очень малыми энергиями активации проводимости-порядка сотых долей электронвольта. Для соединений  $Bi_{4-x}Nd_xTi_3O_{12}$  (x = 0.1, 0.3,0.5, 0.7) наблюдается область с ярко выраженной примесной проводимостью в интервале температур от 20°С до 200°С.

да висмута [53]. Энергия активации Е<sub>а</sub> проводимости

определялась из уравнения Аррениуса

При легировании  $Bi_4Ti_3O_{12}$  неодимом энергия активации проводимости практически не меняется в низкотемпературной и высокотемпературной областях (см. табл. 3). Инвариантность энергии активации проводимости свидетельствует о постоянстве характера проводимости в синтезированном  $Bi_{4-x}Nd_xTi_3O_{12}$  (x = 0.1, 0.3, 0.5, 0.7) ряде соединений.

## 4. Заключение

В настоящей работе развиваются исследования электрофизических свойств перовскитоподобных оксидов  $Bi_{4-x}Nd_xTi_3O_{12}$  (x = 0.1, 0.3, 0.5, 0.7), испытанных на близких ФА [38,47–50]. Таким образом, керамика была изготовлена традиционным методом твердофазной реакции. Рентгенограммы были проиндексированы как орторомбические B2cb для всех ФА. Как и ожидалось, легирование Nd<sup>3+</sup> уменьшило тангенс угла диэлектрических потерь в два раза по сравнению с нелегированным Bi<sub>4</sub>Ti<sub>3</sub>O<sub>12</sub>. Минимальная температура Кюри  $T_{\rm C} = 580^{\circ}$ С для синтезированного ряда соединений Nd<sub>x</sub>Ti<sub>3</sub>O<sub>12</sub> (x = 0.1, 0.3, 0.5, 0.7) была достигнута для Bi<sub>4-x</sub>Nd<sub>x</sub>Ti<sub>3</sub>O<sub>12</sub> при x = 0.1.

Легирование  $Nd^{3+}$  снижает температуру Кюри с ростом *x*. Значения относительной диэлектрической проницаемости  $\varepsilon/\varepsilon_0$  для всех образцов, спеченных при

1050°С, были в 1.5-2 раза больше, чем для образцов, спеченных при 1000°С. Все образцы характеризовались увеличением размера зерна с ростом температуры спекания. При легировании  $Bi_4Ti_3O_{12}$  неодимом  $Nd^{3+}$  энергия активации проводимости в низкотемпературной и высокотемпературной областях практически не изменилась, как следует из табл. 3.

#### Финансирование работы

Исследования проводились с использованием оборудования Южного федерального университета, а также ЦКП ЮНЦ РАН. Авторы признательны за поддержку Южного федерального университета, грант № 21-19-00423 Российского научного фонда.

#### Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

# Список литературы

- [1] B. Aurivillius. Arkiv. Kemi 1, 499 (1949).
- [2] B. Aurivillius. Arkiv. Kemi 37, 512 (1950).
- [3] Г.А. Смоленский, Р.В. Кожевникова. ДАН СССР **76**, *4*, 519 (1951).
- [4] Г.А. Смоленский, В.А. Исупов, А.И. Аграновская, С.Н. Попов. Сов. физика твердого тела 1, 169 (1959).
- [5] E.C. Subbarao. Phys. Rev. 122, 3, 804 (1961).
- [6] E.C. Subbarao. J. Am. Ceram. Soc. 45, 166 (1962).
- [7] S.V. Zubkov. J. Adv. Dielectrics, 11, 2160018 (2021), DOI:10.1142/S2010135X21600183
- [8] S.V. Zubkov. J. Adv. Dielectrics **10**, *1−2*, 2060002 (2020). DOI:10.1142/S2010135X20600024.
- [9] С.В. Зубков, В.Г. Власенко. ФТТ 59, 12 (2017). DOI: 10.21883/FTT.2017.12.45224.133.
- [10] С.В. Зубков, И.А. Паринов, А.В. Назаренко, Ю.А. Куприна. Phys. Solid State **64**, 10 (2022).
- [11] S.V. Zubkov, S.I. Shevtsova. Part of the Springer Proc. Materials book series 6, 173–182 (2020).
- [12] S.V. Zubkov. DOI:10.1142/S2010135X20600085
- [13] С.В. Зубков, В.Г. Власенко, В.А. Шуваева, С.И. Шевцова. ФТТ 58, 1 (2016).
- [14] C. A.-Pazde Araujo, J.D. Cuchiaro, L.D. McMillan, M.C. Scott, J.F. Scott. Nature London 374, 627 (1995).
- [15] B.H. Park, B.S. Kang, S.D. Bu, T.W. Noh, J. Lee, W. Jo. Nature London 401, 682 (1999).
- [16] L. Pardo, A. Castro, P. Millan, C. Alemany, R. Jimenez, B. Jimenez. Acta Mater. 48, 2421 (2000).
- [17] R.L. Withers, J.G. Thompson, A.D. Rae. J. Solid State Chem. 94, 404 (1991).
- [18] S.E. Cummins, L.E. Cross. J. Appl. Phys. 39, 2268 (1968).
- [19] R. Takahashi, Y. Yonezawa, M. Ohtani, M. Kawasaki, K. Nakajima, T. Chikyow, H. Koinuma, Y. Matsumoto. Adv. Fun. Mater. 16, 485 (2006).
- [20] U. Chon, H.M. Jang, M.G. Kim, C.H. Chang. Phys. Rev. Lett. 89, 87601 (2002).

- [21] J.Y. Choi, C.H. Choi, K.-H. Cho, T.G. Seong, S. Nahm, C.Y. Kang, S.J. Yoon, J.-H. Kim. Acta Mater. 57, 2454 (2009).
- [22] H.N. Lee, D. Hesse, N. Zakharov, U. Gosele. Science 296, 2006 (2002).
- [23] H. Irie, H. Saito, S. Ohkoshi, K. Hashimoto. Adv. Mater. 17, 491 (2005).
- [24] K. Yamamoto, Y. Kitanaka, M. Suzuki, M. Miyayama, Y. Noguchi, C. Moriyoshi, Y. Kuroiwa. Appl. Phys. Lett. 91, 162909 (2007).
- [25] C.B. Long, Q. Chang, H.Q. Fan. Sci. Rep. 7, 4193 (2017).
- [26] H. Watanabe, T. Kimura, T. Yamaguchi. Am. Ceram. Soc. Bull. 74, 139 (1991).
- [27] J. Liu, Z. Shen, M. Nygren, Y. Kan, P. Wang. J. Eur. Ceram. Soc. 23, 3233 (2006).
- [28] M. Takahash, Y. Noguchi, M. Miyayam. Jpn. J. Appl. Phys. 42, 6222 (2003).
- [29] H.S. Shulman, D. Damjanovic, N. Setter. J. Am. Ceram. Soc. 83, 528 (2000).
- [30] M. Takahashia, Y. Noguchi, M. Miyayam. Solid State Ion. 172, 325 (2004).
- [31] H.S. Shulman, M. Testorf, D. Damjanovic, N. Setter. J. Am. Ceram. Soc. 79, 3124 (1996).
- [32] C.B. Long, H.Q. Fan, M.M. Li, G.Z. Dong, Q. Li. Scr. Mater. 75, 70 (2014).
- [33] C. Long, B. Wang, W. Ren, K. Zheng, H. Fan, D. Wang, L. Liu. Appl. Phys. Lett. 117, 032902 (2020).
- [34] L. Shen, D. Xiao, J. Zhu, P. Yu, J. Zhu, D. Gao. J. Mater. Syn. Proc. 9, 369 (2001).
- [35] A.Z., C. Quinelato, A. Ries, B.D. Stojanovic, E. Longo, J.A. Varela. Mater. Chem. Phys. 98, 481 (2006).
- [36] S.W. Kang, M.K. Song, S.W. Rhee, J.H. Suh, C.G. Park. Integr. Ferroelectrics 72, 61 (2005).
- [37] B.D. Stojanovic, A.Z. Simões, C.O. Paiva-Santos, C. Quinelato, E. Longo, J.A. Varela. Ceram. Int. 32, 707 (2006).
- [38] Y. Kan, X. Jin, G. Zhang, P. Wang, Y.B. Cheng, D. Yan. J. Mater. Chem. 14, 3566 (2004).
- [39] P.-H. Xiang, Y. Kinemuchi, K. Watari. J. Eur. Ceram. Soc. 27, 663 (2007).
- [40] U. Chon, H.M. Jang, I.W. Park, Solid State Commun. 127, 469 (2003).
- [41] J.C. Bae, S.S. Kim, E.K. Choi, T.K. Song, W.J. Kim, Y.I. Leed, Thin Solid Films. 472, 90 (2005).
- [42] Y. Kan, P. Wang, Y. Li, Y.-B. Cheng, D. Yan. J. Eur. Ceram. Soc. 23, 2163(2003).
- [43] W. Chen, Y. Kinemuchi, T. Tamura, K. Miwa, K. Watari. Mater. Res. Bull. 41, 2094 (2006).
- [44] W. Chen,Y. Hotta, T. Tamura, K. Miwa, K. Watari. Scripta Mater. 54, 2063 (2006).
- [45] SV. Zubkov, I.A. Parinov, A.V. Nazarenko, Y.A. Kuprina. Physics and Mechanics of New Materials and Their Applications–Proceedings of the International Conference PHENMA 2021-2022, Springer Proceedings in Materials / Eds I.A. Parinov, S.-H. Chang, A.N. Soloviev. Springer Nature, Switzerland 20, 163 (2023).
- [46] W. Kraus, G. Nolze. Powder Cell for Windows 2.39, Federal Institute for Materials Research and Testing, Berlin (1999).
- [47] H.L. Du, W.C. Zhou, F. Luo, D.M. Zhu. Appl. Phys. Lett. 91, 202907 (2007).

- [48] Z.P. Yang, Y.F. Chang, B. Liu, L.L. Wei, Mater. Sci. Eng. A 432, 292 (2006).
- [49] R.E. Newnham, R.W. Wolf, J.F. Dorrian, Mat. Res. Bull. 6, 1029 (1971).
- [50] M. Li, Z. Shen, M. Nygren, A. Feteira, D.C. Sinclair, A.R. West. J. Appl. Phys. 106, 04106 (2009).
- [51] V.M. Goldschmidt. Geochemische Verteilungsgesetze der Elemente, J. Dybwad, Oslo, 1923 (1927).
- [52] R.D. Shannon, Acta Crystallogr. A 32, 751 (1976).
- [53] V.A. Isupov. Ferroelectrics **189**, 211 (1996).
- Редактор Т.Н. Василевская